双 N 沟道 MOSFET

ELM52920WA-N

■概要

ELM52920WA-N 是 N 沟道低输入电容、低工作电压、低导通电阻的大电流 MOSFET，内藏有两个 MOSFET。另外，此芯片还内藏 ESD 保护电路。

■特点

- Vds=20V
- Id=4.5A
- Rds(on) = 19mΩ (Vgs=4.5V)
- Rds(on) = 23mΩ (Vgs=2.5V)
- Rds(on) = 34mΩ (Vgs=1.8V)
- ESD 保护

■绝对最大额定值

如没有特别注明时, Ta=25℃

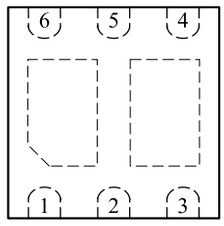
项目		记号	规格范围	单位
漏极 – 源极电压		Vds	20	V
栅极 – 源极电压		Vgs	± 12	V
漏极电流（Tj=150℃）	Ta=25℃	Id	4.5	A
	Ta=70℃		4.5	
漏极电流（脉冲）		Idm	20	A
容许功耗	Tc=25℃	Pd	7.8	W
	Tc=70℃		5.0	
动作结合部温度		Tj	150	℃
保存温度范围		Tstg	– 55 ~ 150	℃

■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位
最大结合部 – 环境热阻	Rθja		52.0	℃/W
最大结合部 – 外封装	Rθjc		12.5	℃/W

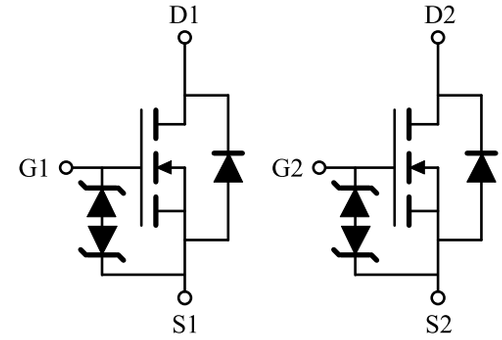
■引脚配置图

DFN6–2 × 2(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	SOURCE1
2	GATE1
3	DRAIN2
4	SOURCE2
5	GATE2
6	DRAIN1

■电路图



如需确认语言的准确性，请参考 ELM 的英文版或日文版。

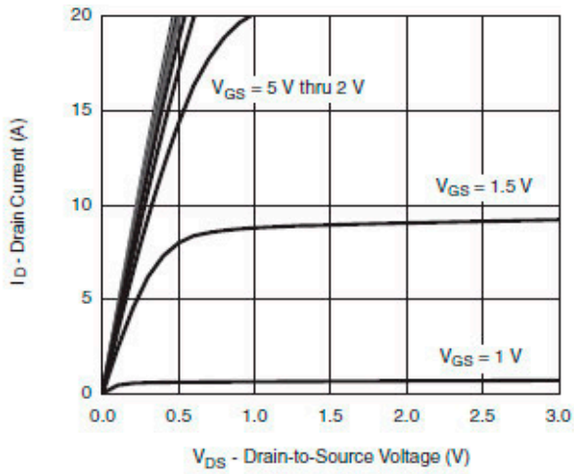
■电特性

如没有特别注明时, Ta=25℃

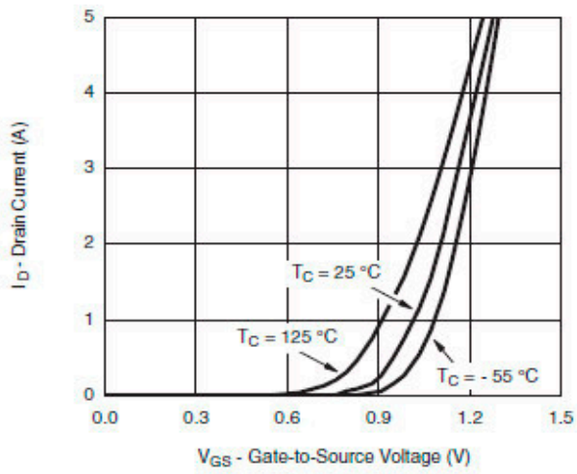
项目	记号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态特性							
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	Id=250μA, Vgs=0V		20			V
栅极接地时漏极电流	Idss	Vds=16V, Vgs=0V				1	μA
			Ta=85℃			10	
栅极漏电电流	Igss	Vds=0V, Vgs= ± 12V				± 10	μA
栅极阈值电压	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250μA		0.4		1.0	V
导通时漏极电流	Id(on)	Vgs=4.5V, Vds≧5V		15			A
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	Vgs=4.5V, Id=5.0A			15	19	mΩ
		Vgs=2.5V, Id=4.6A			18	23	
		Vgs=1.8V, Id=4.2A			27	34	
正向跨导	Gfs	Vds=6V, Id=5.0A			28		S
二极管正向压降	Vsd	Is=1.5A, Vgs=0V			0.85	1.20	V
寄生二极管最大连续电流	Is					1.6	A
动态特性							
输入电容	Ciss	Vgs=0V, Vds=6V, f=1MHz			620		pF
输出电容	Coss				180		pF
反馈电容	Crss				100		pF
开关特性							
总栅极电荷	Qg	Vgs=4.5V, Vds=6V, Id≡5.0A			6.0	12.0	nC
栅极 – 源极电荷	Qgs				0.8		nC
栅极 – 漏极电荷	Qgd				0.8		nC
导通延迟时间	td(on)	Vgs=4.5V, Vds=10V RL=5.5Ω, Id≡3.6A, Rgen=6Ω			10	20	ns
导通上升时间	tr				10	20	ns
关闭延迟时间	td(off)				25	40	ns
关闭下降时间	tf				10	20	ns

如需确认语言的准确性 , 请参考 ELM 的英文版或日文版。

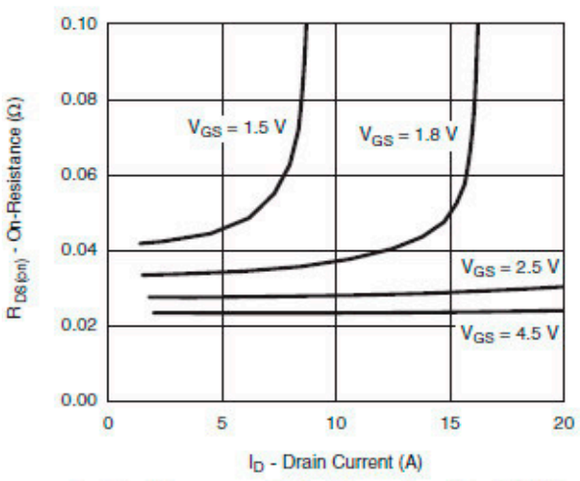
■标准特性和热特性曲线



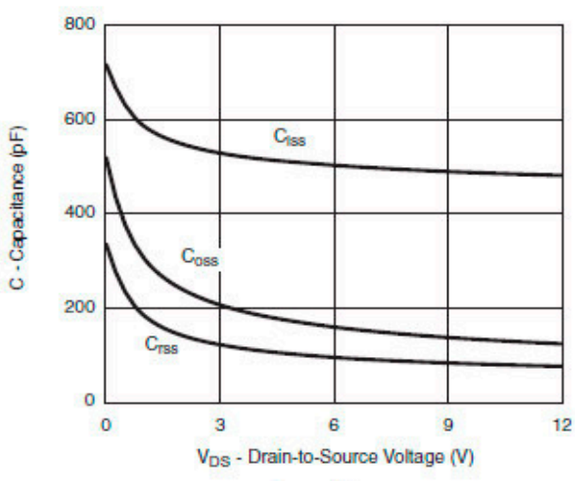
Output Characteristics



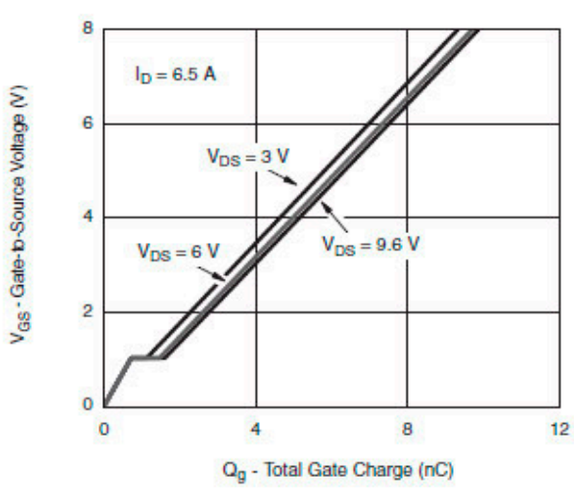
Transfer Characteristics



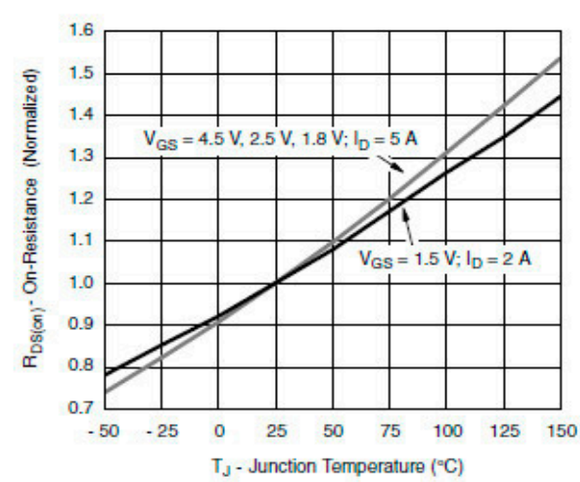
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage



Capacitance

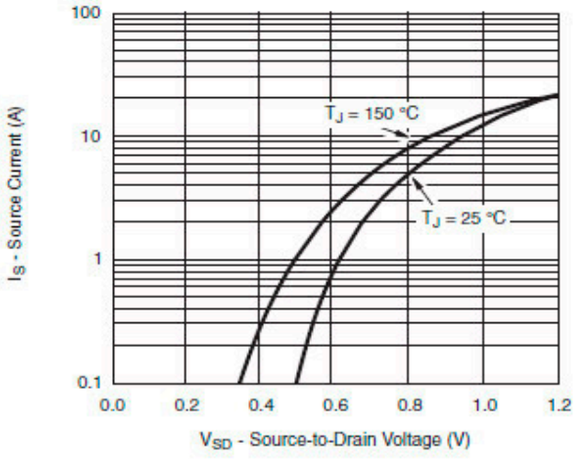


Gate Charge

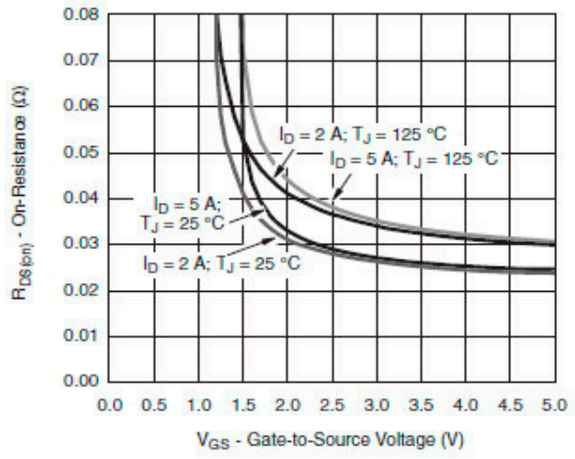


On-Resistance vs. Junction Temperature

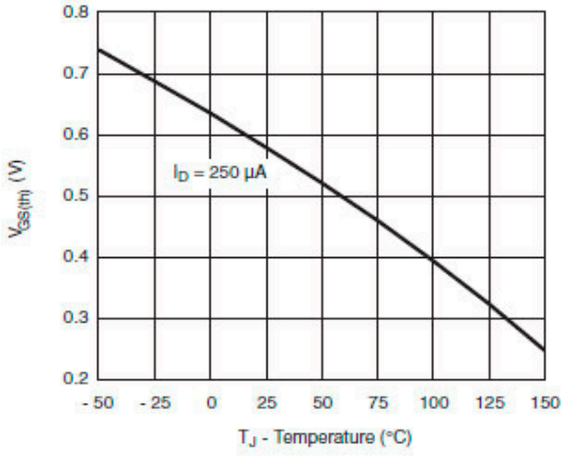
如需确认语言的准确性，请参考 ELM 的英文版或日文版。



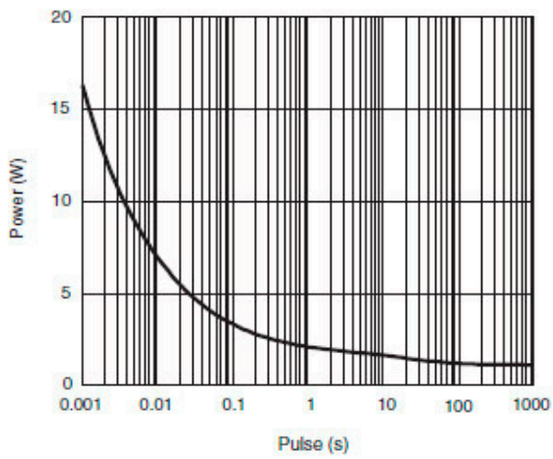
Source-Drain Diode Forward Voltage



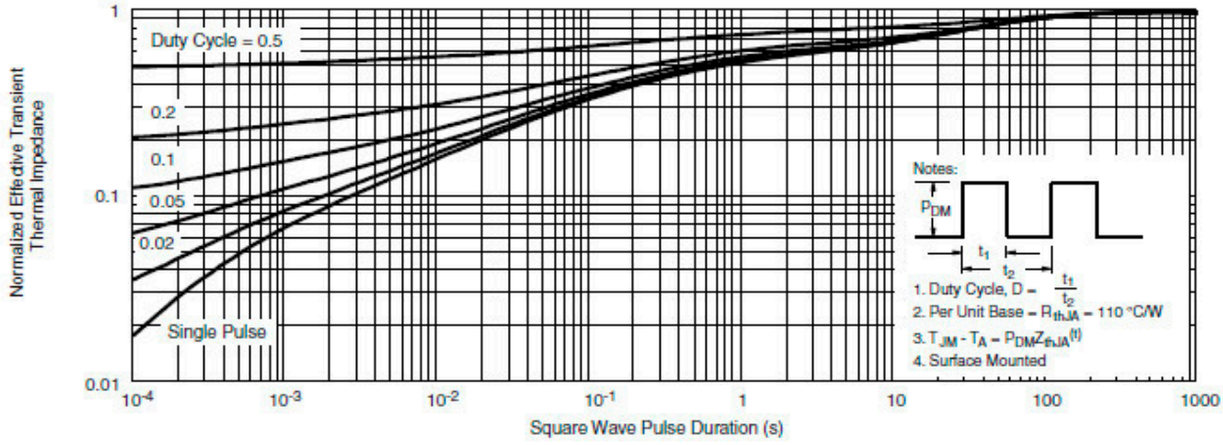
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage



Threshold Voltage



Single Pulse Power (Junction-to-Ambient)

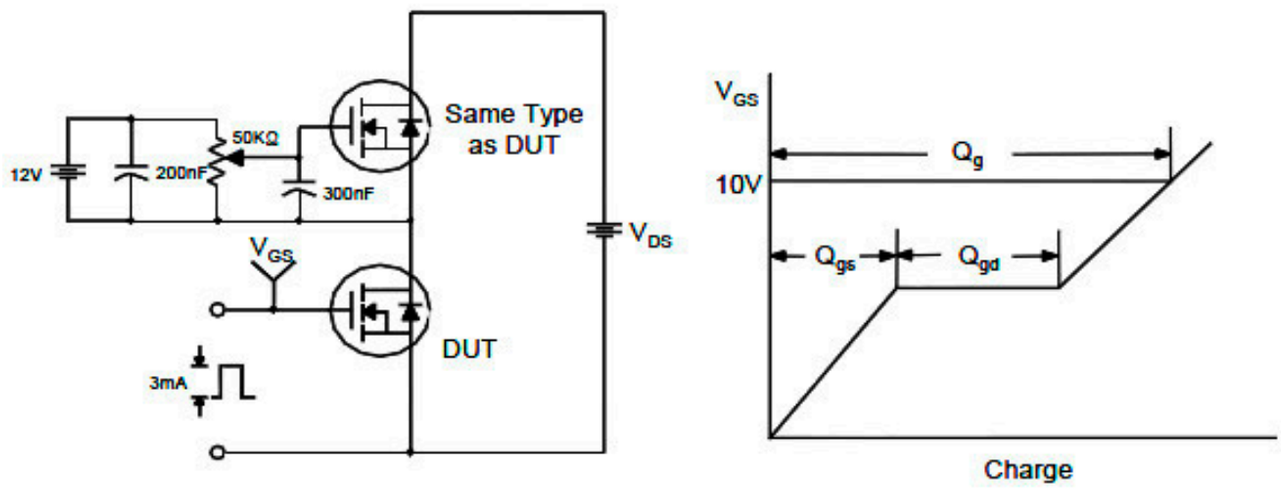


Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient

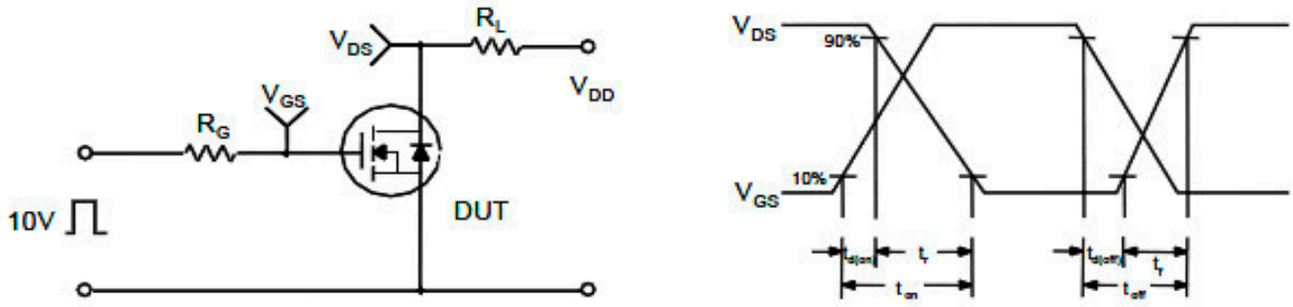
如需确认语言的准确性，请参考 ELM 的英文版或日文版。

■测试电路和波形

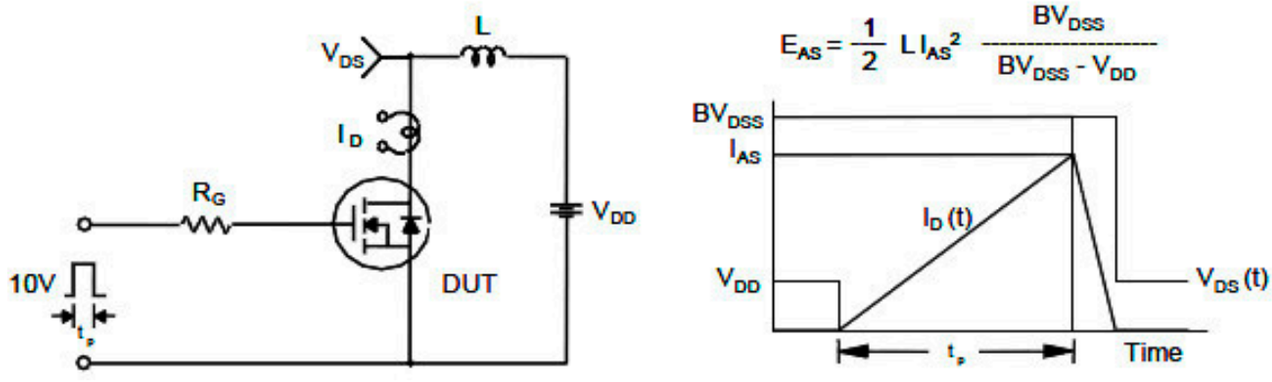
Gate Charge Test Circuit & Waveform



Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms



如需确认语言的准确性，请参考 ELM 的英文版或日文版。